## Лекция 1. Введение

«Применение материалов и компонентов для создания устройств»

### Содержание курса

1) Введение. Запрещенная зона кристалла.

Полупроводники примесные и собственные. Диэлектрики. Гетероструктуры. Внешний и внутренний фотоэффект. Оптическое поглощение и люминесценция.

2) Детекторы на основе полупроводниковых материалов и структур. Фотоумножители (ФЭУ). Ріп-фотодиоды. Лавинные фотодиоды. Микропиксельные фотодиоды. Гибридные ФЭУ. Матричные фотоприемники

### Содержание курса

3) Полупроводниковые источники фотонов. Светоизлучающие диоды. Светодиоды белого света wLED. Лазерные диоды.

4) Применение полупроводниковых детекторов и источников. Фотоприёмники. Регистрация ионизирующих излучений.

5) Наноразмерные излучающие системы. Конфайнмент. Квантовые точки. Практические применения.

### Что нужно для зачета

- Зачет от 55 баллов.
- На первом занятии у каждого 50 баллов
- Две контрольные от +1 до +10 баллов
- Неявка на контрольную -15 баллов
- Неявка на занятие -5 баллов

### Литература

• Ч. Киттель Введение в физику твердого тела

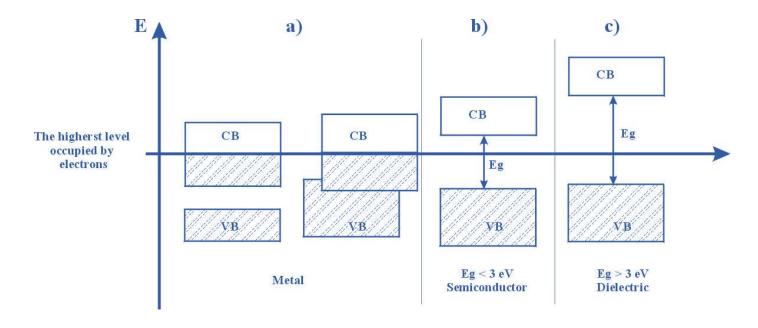
• Б. Салех, М. Тейх Оптика и фотоника. Принципы и применения. Часть 2. Москва, Интеллект, 2012

Introduction to
Solid State Physics

CHARLES KITTEL



### Введение. Запрещенная зона



<u>Запрещенная зона</u> (bandgap) в твердых телах – это диапазон энергий, которые ни один электрон в твердом теле не может иметь.

<u>Валентная зона</u> (Valence Band) — энергетическая область разрешённых электронных состояний в твёрдом теле, заполненная валентными электронами.

<u>Зона проводимости</u> (Conductivity Band) — в зонной теории твёрдого тела первая из незаполненных электронами зон (диапазонов энергии, где могут находиться электроны) в полупроводниках и диэлектриках. Электроны из валентной зоны, преодолев запрещённую зону, при ненулевой температуре попадают в зону проводимости и начинают участвовать в проводимости, то есть перемещаться под действием электрического поля.

# Введение. Модель почти свободных электронов

• В модели свободных электронов волновая функция электрона имеет следующий вид (плоская волна):

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega_r}} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}$$

значение их энергий имеет следующее распределение (электронный газ):

$$E_k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

Пусть электроны находятся в некотором периодическом поле *V*, в котором периодический потенциал кристаллической решётки считается малым возмущением относительно свободного движения валентных электронов.

$$E = \langle H \rangle = \int_{\Omega_r} \psi_{\mathbf{k}}^*(\mathbf{r}) [T + V] \psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) d\mathbf{r}$$

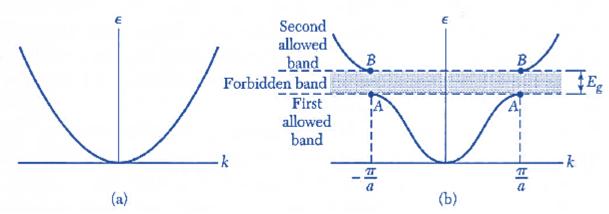
## Введение. Модель почти свободных электронов

$$E_k = \frac{1}{\Omega_r} \int_{\Omega_r} e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} \left[ \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + V(\mathbf{r}) \right] e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}} d\mathbf{r} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} + |V|$$

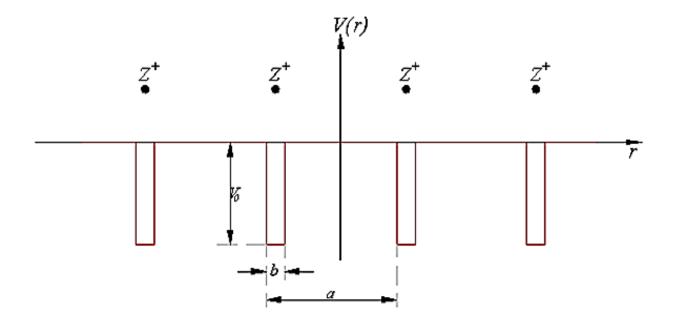
Закон дисперсии на границе. В промежутке энергий между  $E=rac{\hbar^2 k^2}{2m}-V$  и  $E=rac{\hbar^2 k^2}{2m}+V$  электронных уровней нет, чем определяется существование узкой запрещенной зоны.

#### Свободный электрон

#### Почти свободный электрон



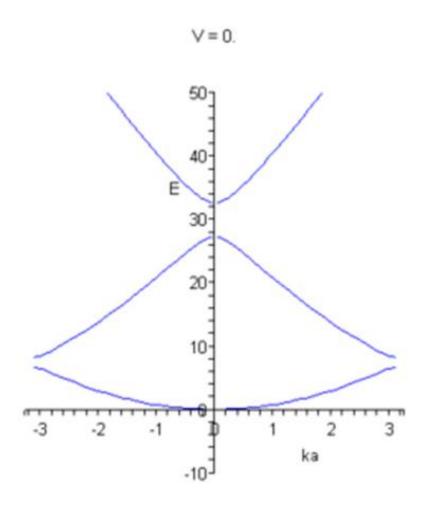
### Введение. Модель Кроннига-Пенни



$$\cos(ka)=\cos(lpha a)-Prac{\sin(lpha a)}{lpha a}(P=rac{eta^2ab}{2})$$
, где  $lpha^2=rac{2mE}{\hbar^2}$ 

Это уравнение показывает соотношение между энергией (через  $\alpha$ ) и волнового вектора k, и, видно, что с левой стороны уравнения решения есть только в диапазоне от -1 до 1, то есть некоторые ограничения на возможные значения энергии, то есть существует зоны запрещенных энергий.

### Введение. Модель Кроннига-Пенни



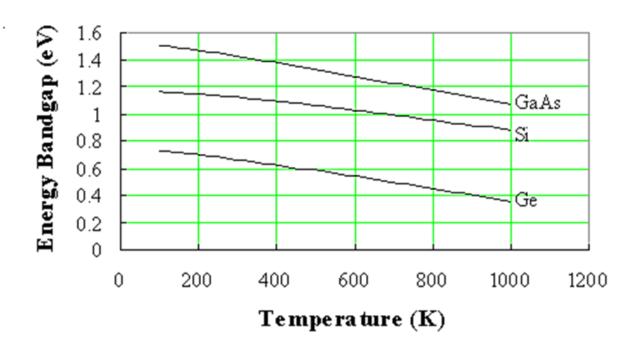
$$\cos(ka)=\cos(lpha a)-Prac{\sin(lpha a)}{lpha a}(P=rac{eta^2ab}{2})$$
, где  $lpha^2=rac{2mE}{\hbar^2}$ 

Это уравнение показывает соотношение между энергией (через  $\alpha$ ) и волнового вектора k, и, видно, что с левой стороны уравнения решения есть только в диапазоне от -1 до 1, то есть некоторые ограничения на возможные значения энергии, то есть существует зоны запрещенных энергий.

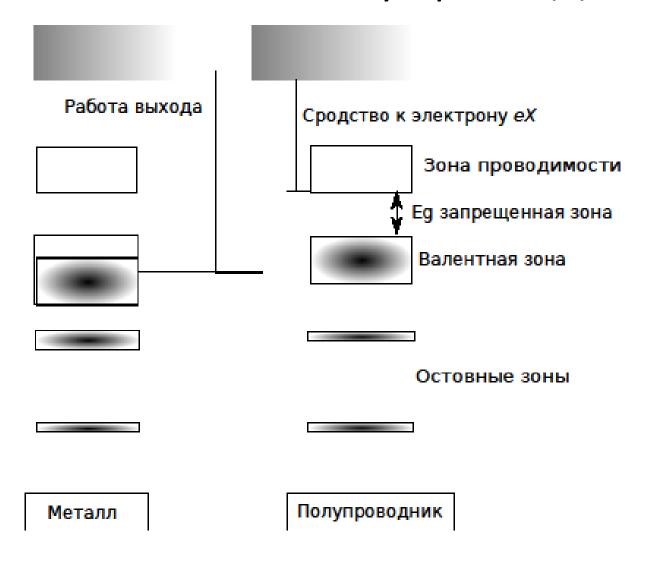
# Температурная зависимость ширины запрещенной зоны

Энергия запрещенной зоны полупроводников уменьшается с повышением температуры. Это связано с тем, что межатомное расстояние увеличивается, когда амплитуда колебаний атомов увеличивается за счет увеличения тепловой энергии.

$$E_{g}(T) = E_{g}(0) - \frac{\alpha T^{2}}{T + \beta}$$

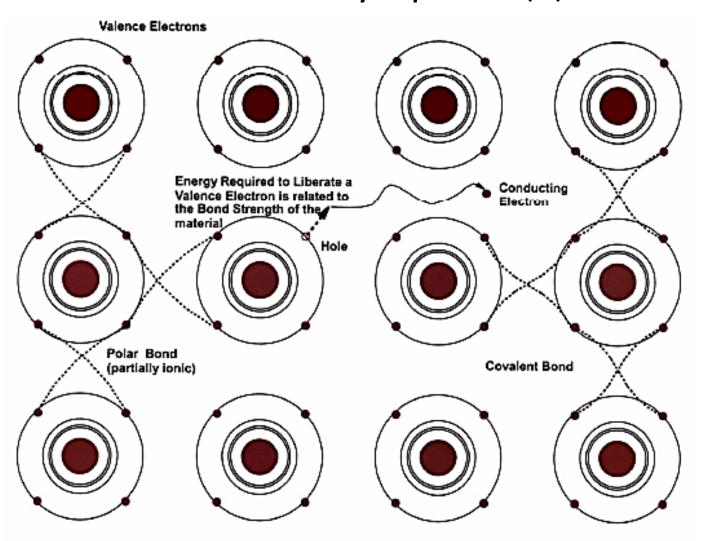


### Отличие полупроводников от металлов



В полупроводнике существует полностью заполненная зона — валентная зона, поэтому подвижность электронов ограничена, в металле зона заполнена не полностью

### Отличие полупроводников от металлов



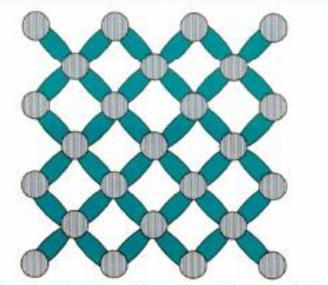
В металлах преобладает металлическая связь, то есть валентные электроны слабо связан и могут свободно перемещаться по веществу

В полупроводниках и диэлектриках, где в основном имеется ковалентный и ионный тип связи, электроны достаточно хорошо связаны

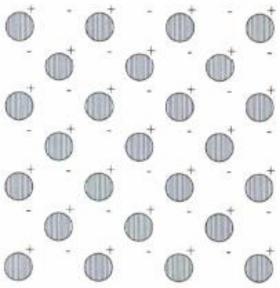
### Типы химических связей



Ionic Bonding: One atom acquires and holds the electron(s) of an adjacent atom. Bonding is coulombic and strong.



Covalent Bonding: Atoms share electrons with the surrounding atoms. Bonding is moderately weak.



Metallic Bonding: Atoms give up electrons to the surrounding regions, forming an "electron cloud". Bonding is coulombic but weak due to screening of charge.

### 4 элемента с ковалентной связью

		1 2 New Notation Group Previous IUPAC Form										► 13 ► IIIB	14 IVB	15 VB	16 VI		17 VIIB	18				
		TA	17.4					CARN					,		<b>►</b> IIIA	IVA	VA	VI		VIIA	VIIIA	Shell
		Ат. Р	'адиу	/с/Пс	ост. Р	еше.	тки А				Eg	g, eV									He 4.002602 2	К
С					0,91	/3,5	6						5,47	ites	5 B	6 +2 C +4 4		+1 8 +2 O +3 O +4 +5		F	10 ° Ne	
Si					1,46	/5,4	3						1,12	12	10.811 2-3 13 Al	12.0107 2-4 14 +2 Si +4 -4	-5	-1 -2 -3 2-6 +3 +5 -3 S	+4	18.9984032 2-7 17 +1 Cl +5 +7	20.1797 2-8 18 0 Ar	K-L
														IIB IIB	26.98153 2-8-3	28.0855 2-8-4	0.973761 -8-5	32.066 2-8-6	5	35.4527 2-8-7	39.948 2-8-8	K-L-M
Ge					1,52	/5,6	5						0,66	0 +2 'n	Ga	32 +2 Ge +4		+3 +5 -3 Se	+4 +6 -2	35 +1 Br +5	36 <sup>0</sup> Kr	
Sn					1,72	/6,4	9						0,08	5.39 3-18-2 8 +2	69.723 -8-18-3 2 49 · In	72.61 -8-18-4 50 +2 Sn +4	4.92160 8-18-5 1 3b	78.96 -8-18- +3 52 +5 Te	$\overline{}$	79.904 -8-18-7 53 +1 I +5 +7	83.80 -8-18-8 54 0 Xe	-L-M-N
		-18-8-1	-18-8-2	-18-9-2	-18-10-2	-18-12-1	-18-13-1	-18-13-2	-18-15-1	-18-16-	-1	-18-18-0	-18-18-1	12.411 -18-18-2	114.818 -18-18-3	118.710 -18-18 -4	21.760 18-18-5	127.60 -18-18	0 8-6	-1 126.90447 -18-18-7	131.29 -18-18-8	-M-N-O
	р.									6-				0 +1 Ig +2	81 T1	82 +2 Pb +4	3 3i	+3 +5 Po	+2 +4	85 At	86 <sup>0</sup> Rn	
	<b>B</b> K	аком	элег	мент	е ато	МЫ	распо	копс	кены	ΙΟЛΙ	Ж	ke BC	егог	2-18-2	204.3833 -32-18-3	207.2 -32-18-4	08.98038 32-18-5	(209) -32-18	8-6	(210) -32-18-7	(222) -32-18-8	-N-O-P
l		(223) -18-8-1	Ra (226) -18-8-2	Ac (227) -18-9-2	(261) -32-10-2	(262) -32-11-2	Sg (266) -32-12-2	Bh (264) -32-13-2	HS (269) -32-14-2	(268) -32-15-	- 1	Oun (271) -32-16-2	(272)	12 Uub								-O-P-Q
						50 +3 60 +3 61 +3 62 +2 63 +2 64					+3		3 66 +3	67 +3	68 +3	69 +3	70	+2 71	+3		l ]	
		* Lanthanides		58 +5 Ce +5	Pr Pr	Nd	Pm	Sm +	Eu +	Gd 64		Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	+2 +3 Lu				
				140.116 -19-9-2	140.90765 -21-8-2	144.24 -22-8-2	(145) -23-8-2	150.36 -24-8-2	151.964 -25-8-2	157 .25 -25-9-2		158.92534 -27-8-2		164.93032 -29-8-2	167.26 -30-8-2	168.93421 -31-8-2		174.96 -32-9-	2			-N-O-P
		-18-1			91 +5 Pa +4	U +5	93 +3 Np +5		3 95 + 4 Am +	3 96 5 Cm	+3	97 +3 Bk +4	98 +3 Cf	99 +3 Es	100 +3 Fm	101 +2 Md +3	102 No	+2 +3 Lr	+3			
				232.0381 -18-10-2	231.03588 -20-9-2		(237) -22-9-2	(244) -24-8-2	(243)	(247) -25-9-2		(247) -27-8-2	(251) -28-8-2	(252) -29-8-2	(257) -30-8-2	(258) -31-8-2	(259) -32-8-2	(262) -32-9-				-O-P-Q
		The new I	LIPAC form														are also sho			active	J	

The new IUPAC format numbers the groups from 1 to 18. The previous IUPAC numbering system and the system used by Chemical Abstracts Service (CAS) are also shown. For radioactive elements that do not occur in nature, the mass number of the most stable isotope is given in parentheses.

простые полупроводниковые материалы — собственно химические элементы: бор В, углерод С, германий **Ge**, кремний **Si**, селен Se, сера S, сурьма Sb, теллур Те и йод I

n States 10.811 12.0107 -2 15.9994 18.9984032 20.1797 K-L 26.981538 2-8-3 28.0855 39.948 K-L-M +1 30 +2 Zn -8-18-2 -8-18-3 -8-18-4 -L-M-N -8-18-5 -8-18-8 +2 49 Cd121.760 112.411 114.818 118.710 131.29 -18-18-3 -18-18 -4 -18-18-5 -18-18-6 -M-N-O -18-18-1 -18-18-2 -18-18-7 -18-18-8 Rn 204.3833 -32-18-3 207.2 (222) -32-18-8 32-18-2 -N-O-P -32-18-4-32-18-5 32-18-6 32-18-7 112 Uub -O-P-Q

-N-O-P

-O-P-Q

сложные полупроводниковые материалы входят химические соединения из двух, трёх и более химических элементов

-18-12-1 -18-13-1

-18-13-2

-18-18-0

AIIIBV: InSb, InAs, InP, GaSb, GaP, AlSb, GaN, InN

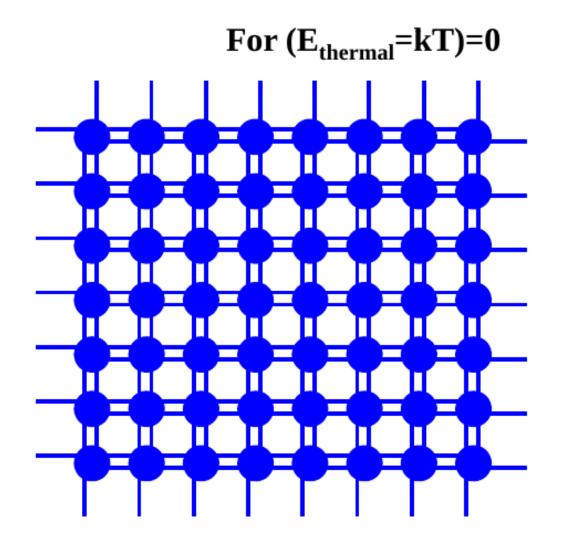
AIIBV: CdSb, ZnSb

AIIBVI: ZnS, ZnSe, ZnTe, CdS, CdTe, HgSe, HgTe, HgS

AIVBVI: PbS, PbSe, PbTe, SnTe, SnS, SnSe, GeS, GeSe

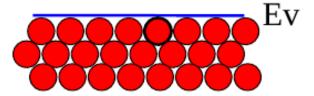
+3	67 +3	68 +3	69 +3	70 +2	71 +3
	Ho	Er	Tm	Yb +3	Lu
0	164.93032	167.26	168.93421	173.04	174.967
	-29-8-2	-30-8-2	-31-8-2	-32-8-2	-32-9-2
+3	99 +3	100 +3	101 +2	102 +2	103 +3
	Es	Fm	Md +3	No +3	Lr
-2	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)
	-29-8-2	-30-8-2	-31-8-2	-32-8-2	-32-9-2

ed by Chemical Abstracts Service (CAS) are also shown. For radioactive

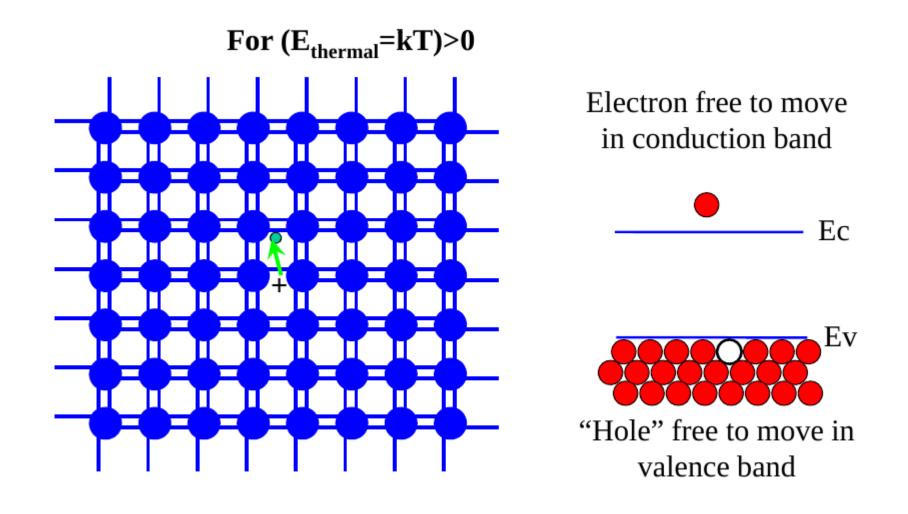


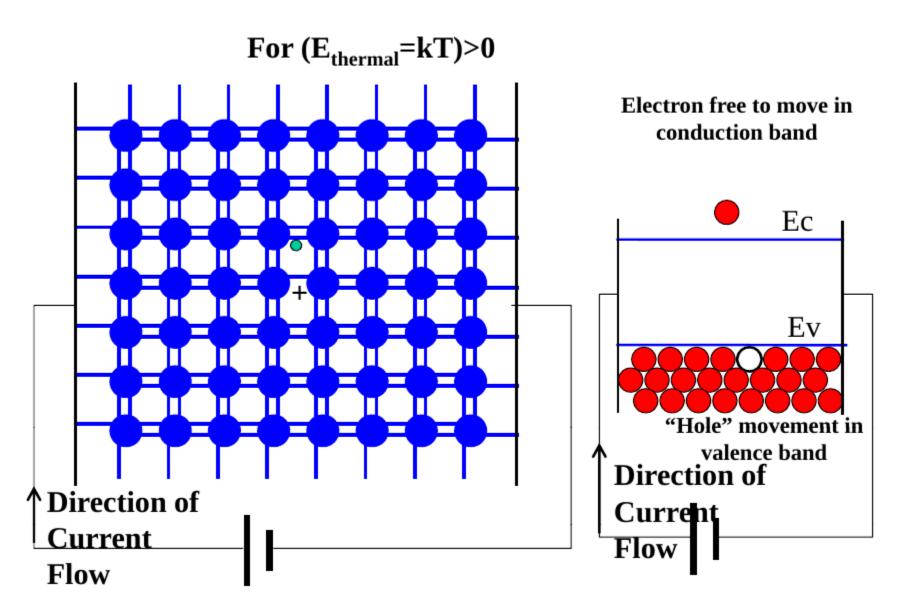
No electrons in conduction band means no electron conduction is possible

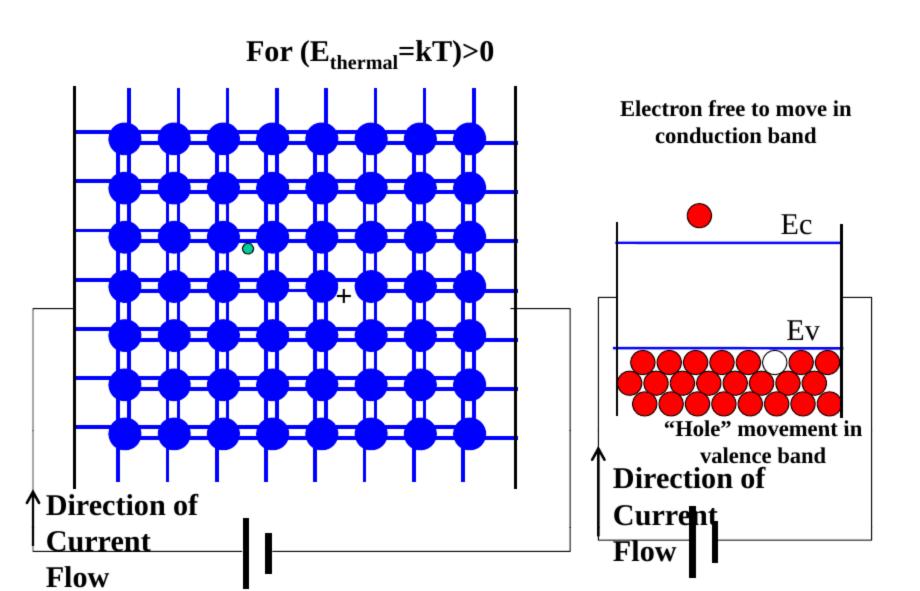
Ec

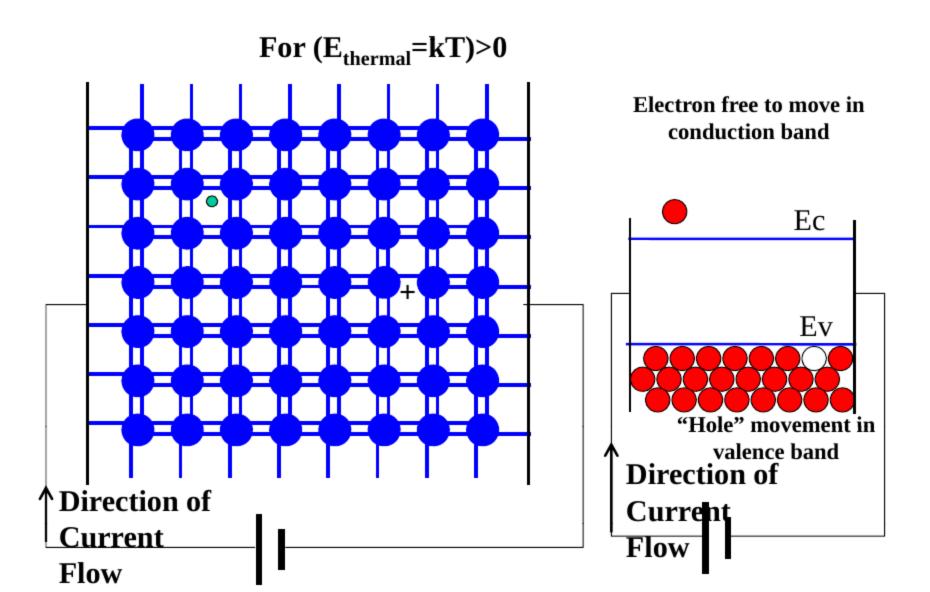


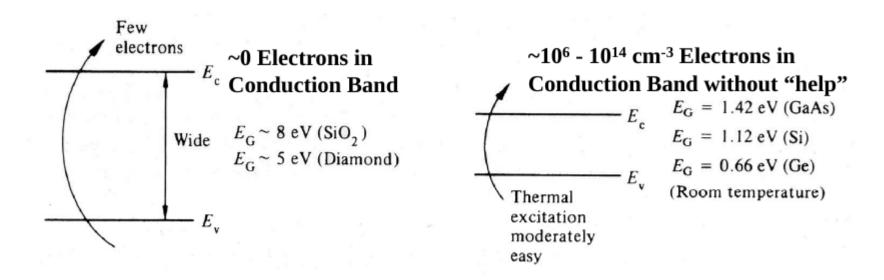
No "Holes" valence band means no "hole" conduction is possible









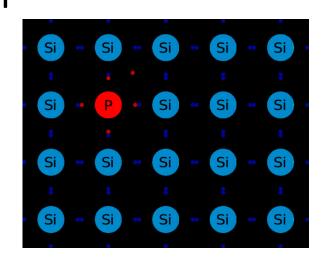


4e22 см<sup>-3</sup> валентных электронов

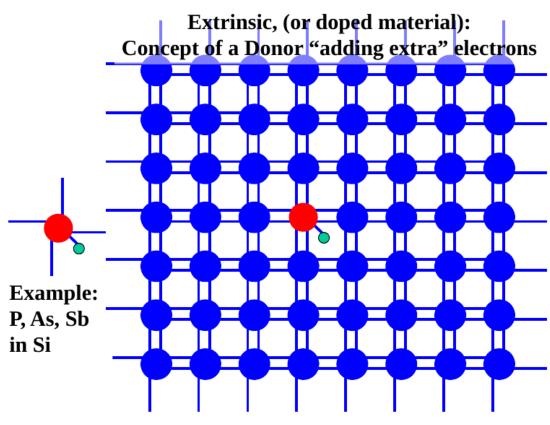
Концентрация собственных носителей заряда в полупроводниках при RT:

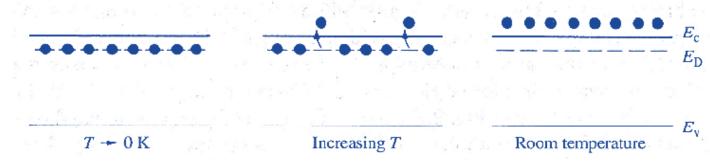
 $n_i$ ~2e6 cm<sup>-3</sup> for GaAs with Eg=1.42 eV,  $n_i$ ~1e10 cm<sup>-3</sup> for Si with Eg=1.1 eV,  $n_i$ ~2e13 cm<sup>-3</sup> for Ge with Eg=0.66 eV,  $n_i$ ~1e-14 cm<sup>-3</sup> for GaN with Eg=3.4 eV

## Примесные полупроводники. Донорные примеси — Extrinsis (or don)



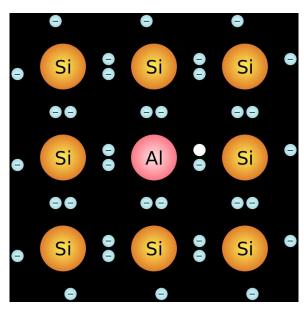
Концентрация доноров 1e13-1e19 cm<sup>-3</sup>

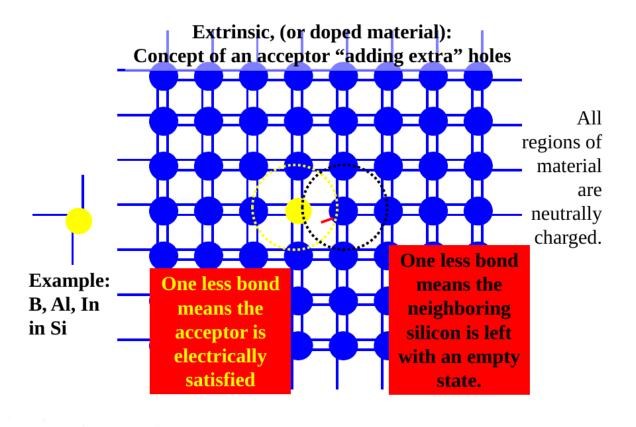


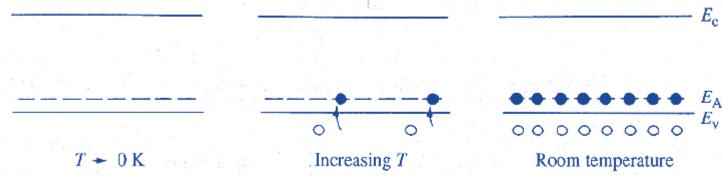


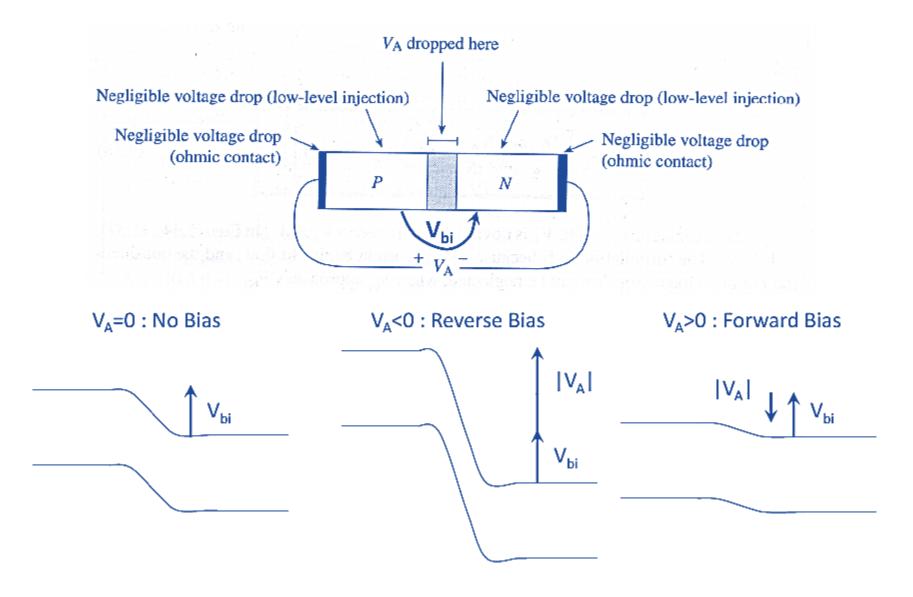
## Примесные полупроводники. Донорные

примеси

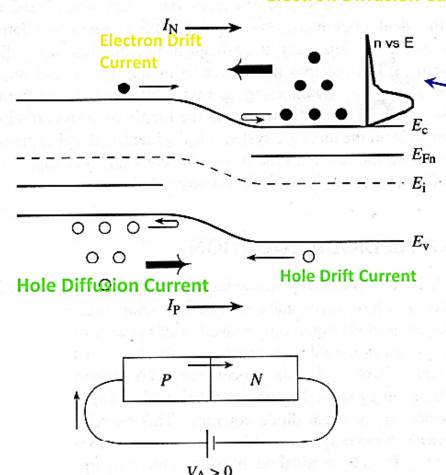








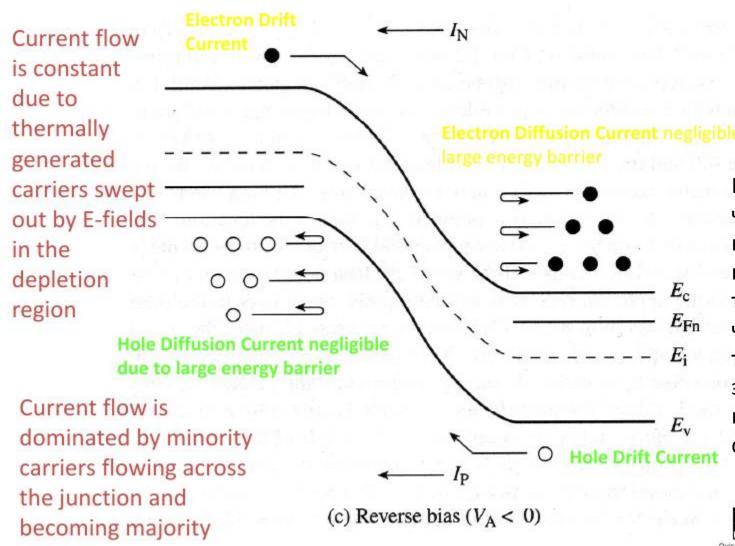
#### **Electron Diffusion Current**



Если к слоям полупроводника приложить внешнее напряжение так, чтобы созданное им электрическое поле было направленным противоположно направлению электрического поля между областями пространственного заряда, то динамическое равновесие нарушается, и диффузионный ток преобладает над дрейфовым током, быстро нарастая с повышением напряжения. Такое подключение напряжения к p-n-переходу называется прямым смещением.

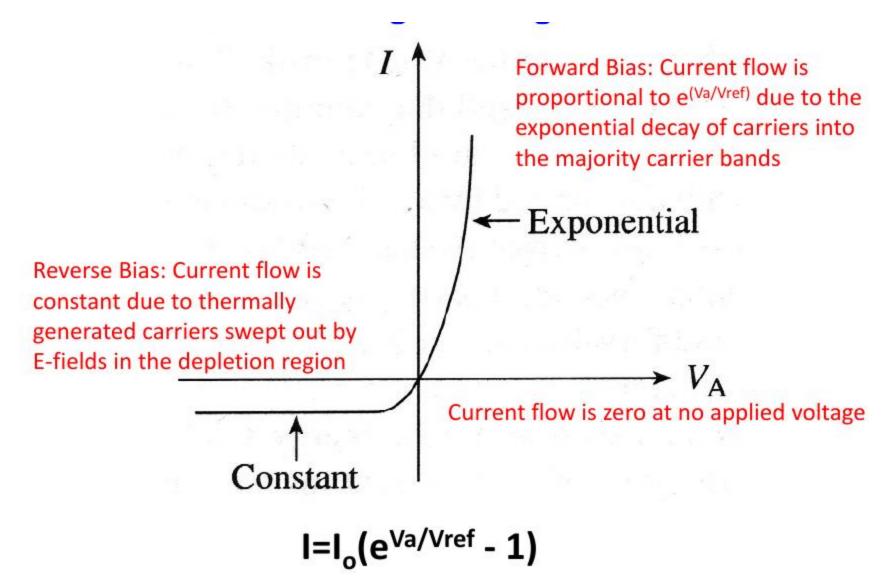


carriers

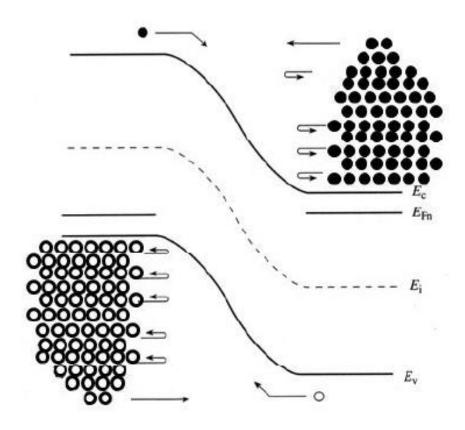


Если же внешнее напряжение приложено так, чтобы созданное им поле было одного направления с полем между областями пространства то это приведет лишь к увеличению толщины слоёв пространственного заряда, и ток через p-n-переход очень мал и определяется тепловой или фотонной генерацией пар электрон-дырка. Такое подключение напряжения к p-n-переходу называется обратным смещением.





### Фотодиод

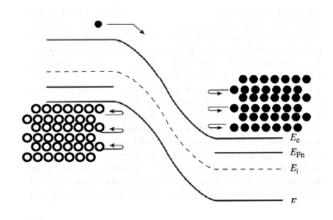


Zero Bias (<u>Equilibrium</u>) Diode with no light illumination has equal amounts of Drift and Diffusion current resulting in no net current flow.

#### Равновесное состояние

В равновесном состоянии, когда поток излучения полностью отсутствует, концентрация носителей, распределение потенциала и энергетическая зонная диаграмма фотодиода полностью соответствуют обычной p-n-структуре.

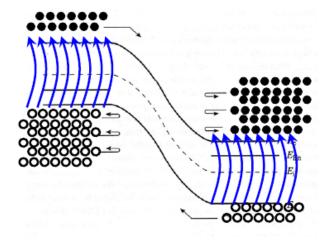
### Фотодиод



 Photodiodes are Reversed Biased Diodes. Case shown with no light illumination.

 Diffusion current is practically zero due to enormous energy barriers preventing diffusion.

•Drift current is small but finite due to minority carriers accelerated by the large electric fields.

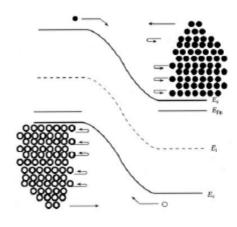


•Case Shown: Reversed Bias
Diode(photodiode) WITH light
illumination

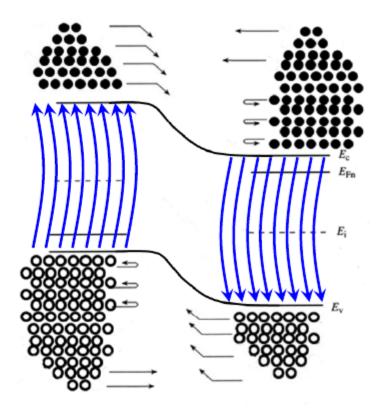
 Again, Diffusion current is practically zero due to enormous energy barriers preventing diffusion.

•Extra photogenerated ehp's that can reach the junction are collected as "extra" drift current В фотодиодном режиме используется источник питания, который смещает фотодиод в обратном направлении. В этом случае через фотодиод течет обратный ток, пропорциональный падающему на него световому потоку. В рабочем диапазоне напряжений (то есть до наступления пробоя), этот ток практически не зависит от приложенного обратного напряжения.

### Солнечная батарея



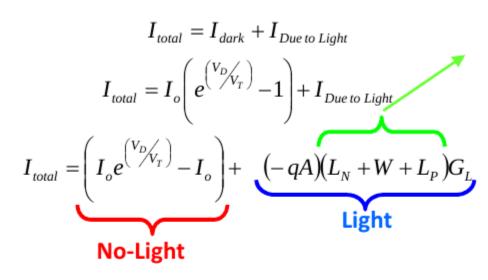
•Zero Bias (<u>Equilibrium</u>) Diode with no light illumination has equal amounts of Drift and Diffusion current resulting in no net current flow.



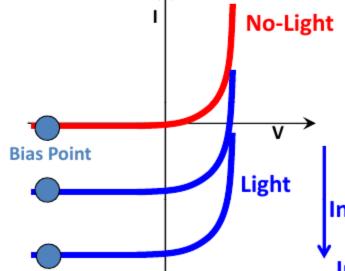
Solar Cell: Forward Biased (due to light)

- •Diode results in "extra" drift current due to photogenerated ehp's (just like a photodiode) that can reach the junction and be collected.
- •This extra collected charge flattens the bands resulting forward bias and partial offsetting by diffusion current.

### Фотодиоды



Explanation of these curves: The IV curve is found by sweeping all voltages and measuring the resulting currents. During operation, the device is held at one operating voltage call the bias point.



Every EHP created within the depletion region (W) and within a diffusion length away from the depletion region is collected (swept across the junction by the electric field) as photocurrent (current resulting from light). All other EHP's recombine before they can be collected.

Photodiode current, just like leakage current is Drift current and thus is in the same direction as the leakage current.

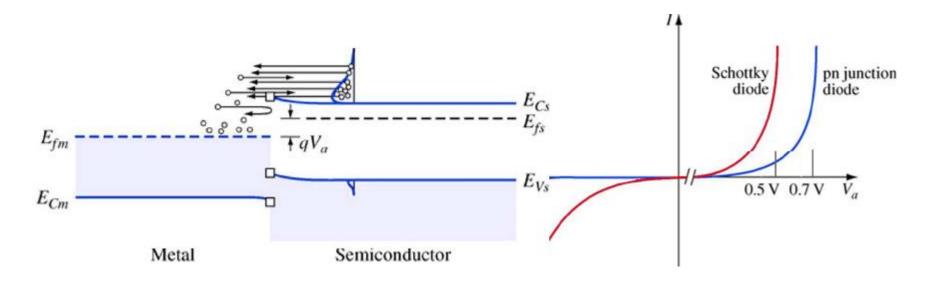
Increasing Light Intensity

### Фотодиоды

Since  $n_p > n_o$  and  $p_n > p_o$  at the

junction edges, the voltage must be positive due to the law of the junction. No-Light 
$$V_A = \frac{kT}{q} \ln \left( \frac{n_p(x = -x_p) p_n(x = x_n)}{n_i^2} \right)$$
Solar Cell acts as a battery producing power lill Anode + Current is "negative" or out of the p-type side (anode)

### Диод Шоттки



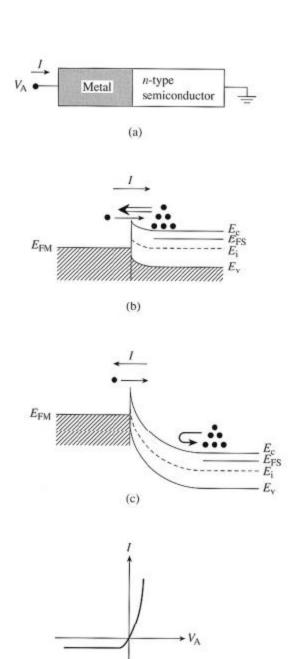
потенциальный барьер, образующийся в приконтактном слое полупроводника, граничащего с металлом, равный разности работ выхода (энергий, затрачиваемых на удаление электрона из твёрдого тела или жидкости в вакуум) металла и полупроводника

### Диод Шоттки

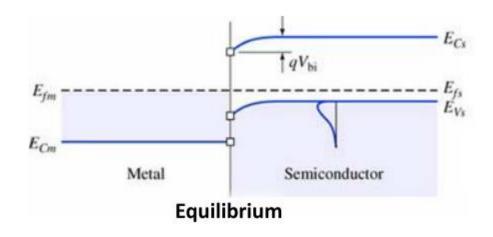
Барьер Шоттки обладает выпрямляющими свойствами. Ток через него при наложении внешнего электрического поля создается почти целиком основными носителями заряда. Контакты металл — полупроводник с барьером Шоттки широко используются в сверхвысокочастотных детекторах, транзисторах и фотодиодах

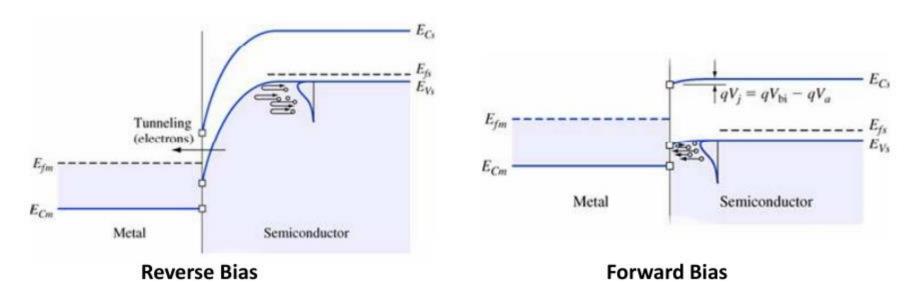
При приложении прямого смещения ток возрастает с экспоненциально с увеличением напряжения

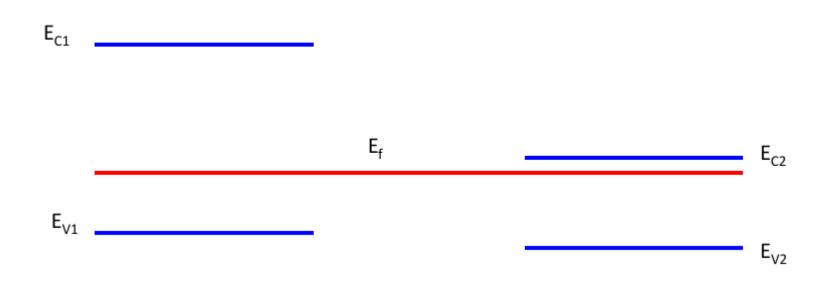
При приложении обратного смещения величина барьера увеличивается, и ток определяется туннельными процессами.



### Диод Шоттки







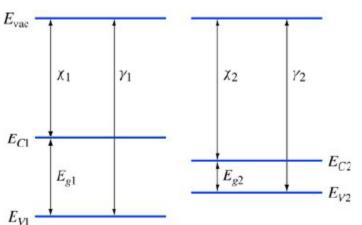
Гетеропереход - Контакт двух различных полупроводников с различными типами проводимости

#### Определения:

#### Сродство к электрону –

энергия необходимая, чтобы электрон из зоны проводимости перешел на уровень вакуума

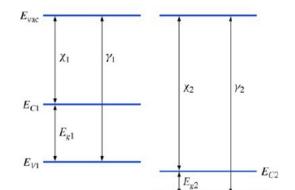
**Потенциал ионизации** — энергия, необходимая валентному электрону для перехода на уровень вакуума



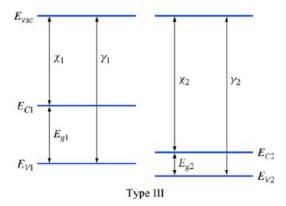
Type I

 $E_{V2}$ 

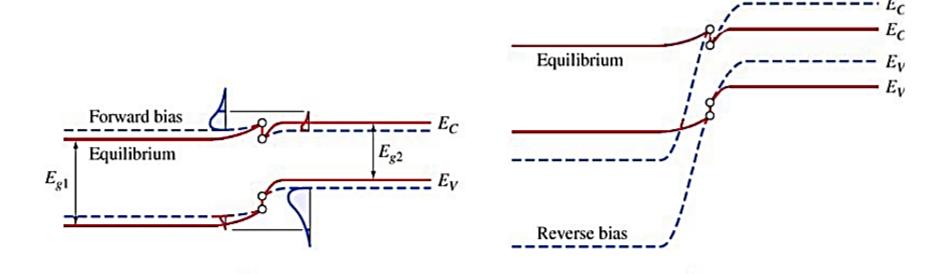
Type I: Straddling (small Eg material is within large Eg band edges)



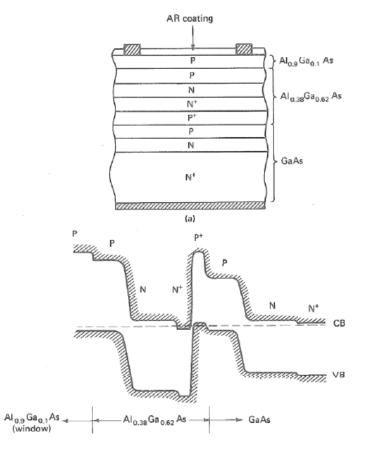
Type II: Staggered (small Eg material is outside of large Eg band edges – either



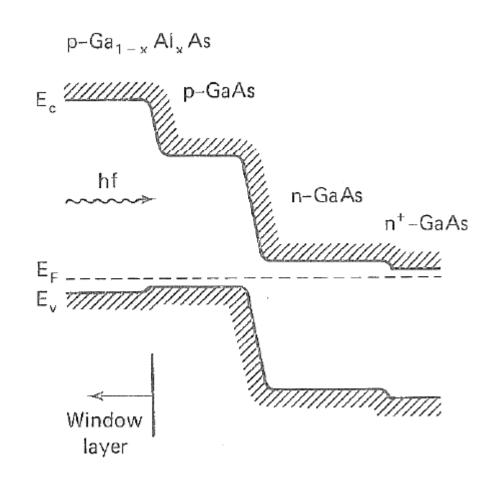
Type III: Broken Gap (One band edge of small Eg is within large Eg band edges – either above or below)



- •Electrons may be easier to inject (lower barrier as in this case) than Holes or vise versa making these junctions inherently asymmetric (useful in both transistors and optical devices).
  - Heterojunction Emitter-Base junctions in Heterojunction Bipolar Transistors result in increased emitter injection efficiency using this effect



Tunnel junction makes a semiconductor-semiconductor ohmic contact between subcells in tandem devices.

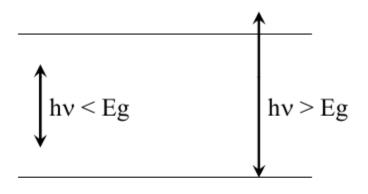


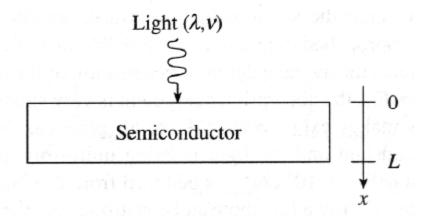
### Оптическое поглощение

Light with photon energy,  $h\nu < Eg$  is not easily absorbed. A convenient expression for the energy of light is  $E=1.24/\lambda$  where  $\lambda$  is the wavelength of the light in um.

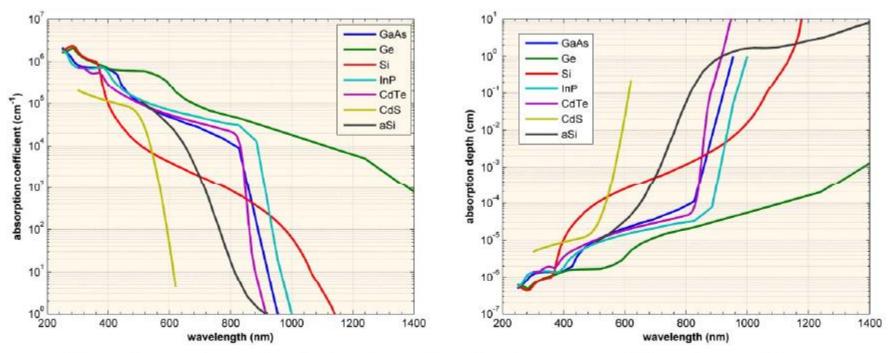
Light with energy, hv > Eg is absorbed with the "unabsorbed" light intensity as a function of depth into the semiconductor is  $I(x) = I_o e^{-\alpha x}$ 

where Io is the initial light intensity, x is distance and  $\alpha$  is the absorption coefficient [1/cm].





### Оптическое поглощение

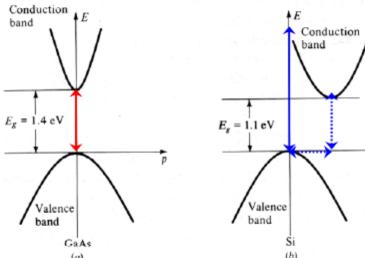


The absorption depth is given by the inverse of the absorption coefficient, or  $\alpha^{-1}$ . The absorption depth gives the distance into the material at which the light at that wavelength drops to about 36% of its original intensity (by a factor of 1/e).

# Оптическое поглощение. Прямозонные полупроводники

Probability of a "direct transition" from valence band to conduction band is high!

#### Direct Bandgap



#### **Indirect Bandgap**

Вероятность прямого перехода выше. Оптическая плотность пропорциональна вероятности перехода

FIGURE 1-12

Energy-band diagram with energy vs. momentum for (a) GaAs (direct) and (b) Si (indirect).

### Выводы

- 1) Вспомнили отличия полупроводников от металлов и диэлектриков
- 2) Узнали чем полупроводники р-типа отличаются от полупроводников n-типа
- 3) Изучили различные типы p-n переходов
- 4) На следующей лекции будем изучать фотоприемники